受理编号：0664-2022

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | 小盘1310模场直径测量 | 被测参数要求(含公差) | （9.2±0.6）μm |
| 被测参数要求识别依据文件 | 光纤成品检验规程（11GC2021） |
| 计量要求导出方法1. 测量参数的允许误差：±0.6 μm 测量参数公差范围：T＝0.6－（-0.6）＝1.2 μm

计量要求： △允＝T/3＝1.2 / 3＝0.4 μm 1. 测量范围的导出

测量范围要求：（9.2±0.6）μm，即 （8.6-9.8）μm光纤光学性能测试仪测量范围为：（8 - 12）μm |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 | 型号规格 | 主要计量特性(最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
| 光纤光学性能测试仪/OF1-002 | PK2200 | 模场直径：*U*=0.18μmk=2 | G22018-14 | 2022.6.7 |
| 计量验证记录1. 采用MCP值验证：

测量参数公差：T＝ 1.2 μm ， 光纤光学性能测试仪模场直径测量不确定度：*U*=0.18μm k=2$ MCP=\frac{T}{2U}=\frac{1.2}{2×0.18}=3.33>1.1$，满足计量要求。1. 测量设备的测量范围：

光纤光学性能测试仪测量范围（8 - 12）μm的满足被测参数（8.6-9.8）μm的范围要求测量设备（8 - 12）μm的光纤光学性能测试仪满足小盘1310模场直径测量过程要求。5e51b0e5c747366a514c29d6f7a84a1验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项）验证人员签字： 验证日期： 2022 年 6 月 17 日 |
| 审核记录：1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求
2. 计量要求导出方法正确
3. 测量设备的配备满足计量要求
4. 测量设备经过校准
5. 测量设备验证正确

秦晓燕电子签名审核员签名：30d79492e978f50f7cbcc25fe8baf4c企业代表签字： 审核日期： 2022 年 11 月 6 日 |

受理编号：0664-2022

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | 护套厚度测量 | 被测参数要求(含公差) |  2mm±0.2mm |
| 被测参数要求识别依据文件 | 光缆工艺文件（13GY601-606C） |
| 计量要求导出方法1. 测量参数的允许误差：±0.2mm 测量参数公差范围：T＝0.2－（-0.2）＝0.4mm

计量要求： △允＝T/3＝0.4 / 3＝0.1mm 1. 测量范围的导出

测量范围要求： 2mm±0.2mm 即（1.8 - 2.2）mm数显卡尺测量范围为：（0 - 150）mm |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 | 型号规格 | 主要计量特性(最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
| 数显卡尺/LG1-030 | 0-150mm | ±0.02mm | 122005341-002 | 2022.4.6 |
| 计量验证记录1. 采用MCP值验证：

测量参数公差：T＝ 0.4mm ， 数显卡尺最大允许误差：±0.02mm$ MCP=\frac{T}{3u}=\frac{0.4}{3×0.02}=6.67>1.1$，满足计量要求。1. 测量设备的测量范围：

数显卡尺测量范围（0 - 150）mm的满足被测参数（2.8 - 3.2）mm的范围要求测量设备（0 - 150）mm的数显卡尺满足护套厚度测量过程要求。验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项）d8a8f5592a9467517b7f45afd4fc411验证人员签字： 验证日期： 2022 年 4 月 1 6 日 |
| 审核记录：1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。
2. 计量要求导出方法正确。
3. 测量设备的配备满足计量要求。
4. 测量设备经过校准。

10.测量设备验证正确。秦晓燕电子签名审核员签名：30d79492e978f50f7cbcc25fe8baf4c企业代表签字： 审核日期： 2022 年 11 月 6 日 |